

ENAC participa activamente en el 5º Congreso Español de Metrología



Cuatro años después de la cita celebrada en Santander, entre los días 12 al 14 de junio, se celebró el 5º Congreso Español de Metrología en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica en Madrid.

En el encuentro, que contó con una alta participación, superior incluso a la del cuarto congreso, ENAC participó una vez más como empresa patrocinadora y como miembro del comité organizador además de en diversas mesas redondas.

El día 14, moderada por D. Manuel Valcarcel (F2I2), se desarrolló una mesa redonda sobre la acreditación en la que participaron D^a. María José Cotarelo, presentando el nuevo esquema de acreditación de productores de materiales de referencia; D^a. Rosalina Porres, explicando cómo afectan los cambios producidos en las normas ISO 17020 e ISO 17065 en los requisitos de acreditación en metrología legal; D. Eugeni Vilalta, presentando los cambios producidos en los documentos de referencia internacionales relacionados con la estimación de la incertidumbre de medida en calibración; D. José Luis Borrego, resumiendo las últimas adaptaciones del sistema de gestión de acreditaciones de laboratorios de calibración y la unificación de los alcances y, finalmente, D. Jaime Fornet que explicó el funcionamiento del SPI como proveedor de programas de intercomparación en calibración desde el INTA.

El congreso incluyó también con una mesa que trató sobre el tema de la Metrología y la Salud en la que D^a. Isabel de la Villa, Jefa del Departamento de Sanidad de ENAC, actuó como moderadora. Por último, y en la mesa de Cooperación Internacional en Metrología, Normalización y Acreditación, D^a. Carmen García, presentó un resumen de las actividades de cooperación en las que ha trabajado ENAC.